^{04,06,13} Монокристаллы (Na_{1/2}Bi_{1/2})(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃: синтез, структура, свойства

© П.П. Сырников, В.Г. Залесский, Н.В. Зайцева, А.В. Халипов, А.И. Федосеев, С.Г. Лушников

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: nsh@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 7 сентября 2024 г. В окончательной редакции 8 сентября 2024 г. Принято к публикации 9 сентября 2024 г.

> Методом спонтанной кристаллизации впервые выращены монокристаллы $(Na_{1/2}Bi_{1/2})(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ (NBMN) — перовскита с разупорядочением в А и В подрешетках. Определены пространственная группа кристалла NBMN ($Pm\bar{3}m$, $a = 3.954 \pm 0.001$ Å) и величина показателя преломления ($n = 2.31 \pm 0.02$, $\lambda = 0.633 \,\mu$ m) при комнатной температуре. На температурных зависимостях диэлектрического отклика в NBMN обнаружены аномалии: частотно-зависимые максимумы диэлектрических потерь в области температур 110 K, характерные для перехода в релаксорное сегнетоэлектрическое состояние и частотно независимая аномалия в окрестности 300 K. Показано существование термоактивированного поведения проводимости с энергией активации 0.66 eV при температуре выше 590 K. Измерение диэлектрического гистерезиса методом PUND выявило существование переключаемой поляризации при 77 K. Анализ диэлектрических свойств позволяет отнести кристалл NBMN к семейству релаксорных сегнетоэлектриков со структурой перовскита.

> Ключевые слова: Сегнетоэлектрики, динамика кристаллической решетки, поляризация, диэлектрические свойства.

DOI: 10.61011/FTT.2024.10.59079.232

1. Введение

Частично разупорядоченные перовскиты с общей формулой А'А"В'В"О3 являются предметом активных исследований как вследствие широкого практического применения многих соединений из этого семейства, так и фундаментального интереса исследователей к влиянию разупорядочения на динамику кристаллической решетки. Релаксорные сегнетоэлектрики (релаксоры) принадлежат к этому семейству перовскитов и характеризуются широкой растянутой на сотни градусов частотно-зависимой аномалией диэлектрической проницаемости, в общем случае не связанной со структурным фазовым переходом [1,2]. Механизмы возникновения аномалии диэлектрического отклика и релаксорного сегнетоэлектрического состояния остаются предметом дискуссии спустя более 60 лет со дня синтеза первых соединений [3]. К настоящему времени известно более 1000 соединений из этого семейства, синтезированных на базе таких классических представителей релаксоров, как PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O₃ (PMN), PbZn_{1/3}Nb_{2/3}O₃ (PZN), $PbSc_{1/2}Nb_{1/2}O_3$ (PSN), $(Na_{1/2}Bi_{1/2})TiO_3$ (NBT) и других [1-5], однако вырастить стехиометрические кристаллы (не на базе твердых растворов), в которых реализуется разупорядочение одновременно двух подрешеток перовскита (А и В) до сих пор не удавалось. Гигантские значения пьезоэлектрического отклика, уникальные диэлектрические свойства релаксоров давно используются в конденсаторостроении, оптоэлектронике, и других областях высокотехнологической промышленности. В последнее время ряд соединений из этого семейства рассматриваются как материалы для электрокалорических охлаждающих элементов [6], накопителей энергии, интегрируемых в микросхемы [7] и др. [8,9]. Ограничивающим фактором для развития технологий создания различных устройств с использованием этих материалов является то, что большинство из релаксоров являются свинец-содержащими соединениями, использование которых признано экологически вредным. Поэтому проблема синтеза новых бессвинцовых релаксорных соединений является крайне актуальной. В настоящей работе представлены результаты синтеза и исследования физических свойств монокристалла нового перовскита $(Na_{1/2}Bi_{1/2})(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ (NBMN), в котором не содержатся ионы свинца и существует частичное разупорядочение как в А-, так и В-подрешетке. "Прародителями" этого нового соединения были кристаллы NBT и PMN, модельные объекты для исследования релаксорного состояния в перовскитах с разупорядочением в А или В подрешетках соответственно.

Кристаллы NBT содержат два иона Na²⁺ и Bi²⁺ в А-подрешетке перовскита [1] и являются одними из немногих представителей релаксоров с этим типом разупорядочения. Первые исследования физических свойств NBT были проведены в конце 50-х годов. Динамика решетки кристаллов NBT демонстрирует нетривиальную последовательностью структурных фазовых переходов и превращений, при которых возникают сегнетоэластические, сегнетоэлектрические и релаксорные состояния [10–13]. Кристаллическая структура NBT при температуре выше ~ 813 К характеризуется кубической симметрией (пр. гр. $Pm\bar{3}m$). При охлаждении происходит антиферродисторсионный фазовый переход первого рода, симметрия кристалла при этом понижается от кубической к тетрагональной Р4bm [14]. При дальнейшем охлаждении ниже 800 К в NBT на низких пробных частотах наблюдается аномалия диэлектрической восприимчивости є' в виде широкого максимума. Максимальное значение ε' достигает $10^3 - 10^4$, а его величина и температура сильно зависит от частоты [15]. Ниже 740 К структурные изменения кристалла NBT достаточно сложны и являются предметом широкой дискуссии: так, например, электронная микроскопия высокого разрешения [14] показала возможность существования промежуточной орторомбической фазы, разделяющей тетрагональную и ромбоэдрическую сегнетоэлектрическую фазы в дополнение к предположению о сосуществовании тетрагональной и ромбоэдрической фаз [16]. В окрестности температуры ~ 620 К наблюдается вторая аномалия диэлектрической проницаемости в виде широкого максимума. При T < 620 K диэлектрическая восприимчивость перестает зависеть от частоты. Для температур ниже ~ 523 К в кристаллах NBT сначала предполагалась ромбоэдрическая симметрия (R3c), а позднее, на основании рентгеноструктурных экспериментов, была предложена также моноклинная симметрия (C_c) или их сосуществование [16]. В этом же температурном диапазоне диэлектрическая проницаемость снова сопровождается относительно небольшой частотной дисперсией [15,17]. Ниже 470 К NBT становится сегнетоэлектриком, для которого оценки коэрцитивного поля и остаточной поляризации дают следующие величины: $E_c = 73 \text{ kV/cm}$ и $P_r = 38 \,\mu\text{C/cm}^2$ [18–20]. Исследование диэлектрических свойств NBT опубликовано в многочисленных работах, в которых существует некоторое расхождение в экспериментальных данных по температурам фазовых переходов и температурным зависимостям диэлектрических параметров [15]. Это может быть связано с технологией роста кристаллов: из расплава или методом Чохральского [21]. Поляризация кристаллов NBT затруднена большим коэрцитивным полем и большой проводимостью (по сравнению со свинцовосодержащими пьезоэлектриками), что является основным препятствием для широкого практического применения [21-23]. Для улучшения пьезоэлектрических свойств NBT в настоящее время проводятся исследования влияния дополнительных примесных ионов, которые замещают ионы Bi и Na в А-позиции, или ионы Ti в В-позиции, либо проводят синтез керамики сложных твердых растворов на основе NBT [22-25].

Релаксорный сегнетоэлектрик PMN представляет другой тип разупорядочения перовскита, в котором существует неупорядоченное распределение двух разновалентных катионов Mg²⁺ и Nb⁵⁺ в В-подрешетке кристалла [1,3]. В PMN наблюдается "размытый фазовый переход", сопровождаемый аномалией диэлектрических свойств в виде широкого и частотно-зависимого максимума диэлектрической восприимчивости с величиной $\varepsilon'(10 \text{ kHz}) = 2 \cdot 10^4$ при $T_{\text{max}} = 275 \text{ K}$ [1,4]. При этом структура PMN остается кубической вплоть до гелиевых температур.

Первые сообщения о попытке синтеза соединений с разупорядочением как в А-, так и в В-подрешетках на основе РМN и NBT были опубликованы в работах [23,25], в которых приводятся данные о синтезе и свойствах пьезоэлектрической керамики Bi_{1/2}Na_{1/2}(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃ (BNMN) и $Bi_{1/2}Na_{1/2}(Ti_{(100-x)}(Mg_{1/3}Nb_{2/3})_x)O_3$, соответственно. Диэлектрическая проницаемость на частоте 1 kHz при комнатной температуре равнялась 250 и показала слабый рост, не более чем на 20%, при нагреве от 300 до 730 К, без каких-либо существенных аномалий. Поляризация керамики ограничивалась пробивным полем 45 kV/cm. Петли сегнетоэлектрического гистерезиса (Р-Е петли), полученные традиционным методом Сойера-Тауэра были сильно искаженной формы и наличие остаточной поляризации не выявлено. Величина пьезомодуля d₃₃ после предварительной поляризации керамики BNMN в предпробойном поле была оценена величиной 1.8 pC/N [25]. Других сведений о попытке синтеза соединений с общей формулой А'А"В'В"Оз в литературе мы не нашли.

Целью настоящей работы является выращивание монокристаллов перовскита $(Na_{1/2}Bi_{1/2})(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3-(NBMN)$ и исследовании его структуры и диэлектрических свойств в широком температурном диапазоне.

2. Синтез и методы исследований

Синтез и рост кристаллов производились методом спонтанной кристаллизации. Исходные компоненты NaBiO₃, MgO, Nb₂O₅ и B₂O₃ были помещены в платиновый тигель и нагреты до 1250° C с выдержкой в течении 3 часов и последующим охлаждением в течение двух недель. В результате были получены прозрачные кристаллы светло-желтого цвета кубической формы размером сторон 5–8 mm. Элементный состав кристаллов NBMN был подтвержден методом рентгеноспектрального микроанализа на микроанализаторе "CAMEBAX".

Для диэлектрических измерений был приготовлен образец площадью 6 mm² с развитой (001) поверхностью, отполированной до оптического качества и покрытой серебряными электродами. Толщина диэлектрического слоя полученной конденсаторной структуры составляла 1 mm. Измерение температурной зависимости комплексной диэлектрической проницаемости производилось импедансметром GoodWill LCR-819 в поле амплитудой 1 V, в частотном диапазоне 0.1–100 kHz и в интервале температур от 77 до 800 К. Проводимость на постоянном токе измерялась тераомметром E6-13A.

Измерения петель диэлектрического гистерезиса производились по схеме Мерца. Ток, проходящий через образец, определялся с помощью нановольтметра по падению напряжения на измерительном сопротивлении $100 \,\mathrm{k\Omega}$. Для создания импульсов треугольной формы высокого напряжения амплитудой до $2 \,\mathrm{kV}$ и длительностью $30 \,\mathrm{s}$ применялся высоковольтный источник напряжения SRS-350, управляемый компьютером.



Рис. 1. Порошковая дифрактограмма (Na_{1/2}Bi_{1/2}) (Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃, полученная при комнатной температуре.

3. Экспериментальные результаты и обсуждение

3.1. Структура кристалла NBMN

При комнатной температуре кристаллы NBMN были оптически изотропны и показатель преломления, определенный по углу Брюстера, оценивался величиной $n = 2.31 \pm 0.02$ на длине волны $\lambda = 0.633 \,\mu$ m. Порошковая дифракция, сделанная с помощью рентгеновского дифрактометра "Дрон-3" определила симметрию кристаллической структуры как кубическую, пр. группа $Pm\bar{3}m$, с постоянной решетки $a = 3.954 \pm 0.001$ Å (рис. 1).

3.2. Диэлектрическая проницаемость

На рис. 2 показаны температурные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости $\varepsilon^* = \varepsilon' - i \varepsilon''$ для разных частот в кристалле NBMN. При комнатной температуре диэлектрическая проницаемость NBMN на частоте 1 kHz равна $\varepsilon' = 230$, тангенс потерь tg $\delta = 0.01$ (для сравнения, NBT: $\varepsilon' = 750$, tg $\delta = 0.05$ [17]). Температурное поведение $\varepsilon'(\omega, T)$ можно условно разделить на три области: высокотемпературную, при T > 400 K, область от 400 до 200 K и низкотемпературную (T < 200 K). В высокотемпературной области, при *T* > 420 К наблюдается рост ε' , сопровождаемый значительной частотной дисперсией — увеличение значений є' значительно на низких частотах, и практически исчезает на высоких (рис. 2, *a*). Эта дисперсия ε' практически не наблюдается на втором участке (от 400 до 250 К) зависимости $\varepsilon'(\omega, T)$, которая демонстрирует широкий максимум с заметным изломом в температурной зависимости $\varepsilon'(T)$ в окрестности 300 К. В интервале температур 250-90 К наблюдается появление слабой дисперсии диэлектрической проницаемости (рис. 2, а). Возможно, что в температурной зависимости $\varepsilon'(\omega, T)$ в NBMN

при T < 350 К, существуют две достаточно широкие аномалии в окрестности 150 и 300 К, суперпозиция которых наблюдается нами в температурном поведении $\varepsilon'(\omega, T)$ при T < 350 К. Можно отметить похожее поведение диэлектрической проницаемости в монокристалле NBT, наблюдаемое в другом температурном диапазоне: широкий максимум ε' при 620 К с большой частотной дисперсией в высокотемпературной области, в отсутствие дисперсии в интервале температур 520–620 К и появление небольшого максимума и слабой дисперсии ε' при температуре ниже 520 К [15,17].

Температурная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости $\varepsilon''(\omega, T)$ в кристалле NBMN показана на рис. 2, *b*. Представленное температурное поведение $\varepsilon''(\omega, T)$ также можно разделить на высоко- и низкотемпературную области. На рис. 2, *b*, в высокотемпературной области (при T > 450 K) наблюдается нелинейный рост величины ε'' при увеличении температуры.



Рис. 2. Температурная зависимость действительной (a) и мнимой (b) частей диэлектрической проницаемости кристалла NBMN на различных частотах. На вставке к рис. 2, *b* показана зависимость температуры максимума T_m от частоты (пунктиром показана зависимость согласно закону Аррениусу, сплошной линией — по Фогелю-Фульчеру).

Так же как для $\varepsilon'(\omega, T)$, увеличение частоты приводит к уменьшению значений $\varepsilon''(\omega, T)$, при этом на высоких частотах становится заметным широкий максимум в окрестности $T_1 \approx 550$ К. В низкотемпературной области зависимости $\varepsilon''(\omega, T)$ хорошо видны две аномалии: частотно независимый максимум в окрестности 300 К и широкий максимум в окрестности $T_m \approx 110$ К на частоте 1 kHz, положение которого смещается в область высоких температур при увеличении частоты (рис. 2, b). Аномалия в окрестности $T_2 \approx 300$ К в поведении $\varepsilon''(\omega, T)$ маскируется на высоких частотах смещением максимума T_m в область высоких температур, но хорошо видна на низких частотах.

Зависимость температуры максимума Т_т от частоты, наблюдаемая в зависимости $\varepsilon''(\omega, T)$ построена на вставке к рис. 2, b и аппроксимировалась с помощью закона Аррениуса $\omega = \omega_0 \exp[-E_a/kT_m]$ и Фогеля-Фульчера $\omega = \omega_0 \exp[-E_a/k(T_m-T_{\rm F})]$, где: ω_0 — частота попыток перескоков, Е_а — энергия активации носителей заряда, k — постоянная Больцмана, T_m — температура максимума и T_F — температура "замерзания" или температура Фогеля-Фулчера. Лучшие результаты были достигнуты при аппроксимации зависимости на вставке к рис. 2, b с помощью выражения для закона Фогеля-Фулчера, с величинами: $E_a = 1.1 \, \text{eV}$, $\omega_0 = 7 \cdot 10^{12} \,\mathrm{s}^{-1}$ и $T_{\mathrm{F}} = 45 \,\mathrm{K}$, в то время как для закона Аррениуса были получены не реалистичные величины соответствующих параметров: $E_a \approx 3 \text{ eV}$ и $\omega_0 \approx 10^{17} \text{ s}^{-1}$. Полученная с помощью такого описания зависимость Т_т от частоты измерений хорошо согласуется с классическим для релаксоров поведением $T_m(\omega)$ [5].

Если сравнивать характер дисперсии на температурной зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости (рис. 2, b) отдельно для высоких и низких температур, то можно отметить, что в первом случае величины потерь больше на низких частотах, а во втором случае — на высоких частотах. В интервале температур 300-350 К происходит изменение знака величины $d\varepsilon''/d\omega$, дисперсии мнимой диэлектрической восприимчивости, что свидетельствует об изменении механизма диэлектрических потерь. Для высоких температур таким механизмом может служить релаксация Максвелла-Вагнера [26]. В случае низких температур диэлектрические потери определяются особенностями поляризации релаксорных сегнетоэлектриков [1]. Повидимому, изменение знака дисперсии $d\varepsilon''/d\omega$ в интервале температур 290-350 К связано с изменением фазового состояния кристалла.

3.3. Проводимость

Анализ температурных зависимостей АС- и DC-проводимости $\sigma_{\rm ac}(\omega, T)$ и $\sigma_{\rm dc}(T)$ является достаточно удобным способом для выявления механизма поведения диэлектрических потерь ε'' на разных частотах и температурах [26]. Для этого необходимо провести преобразования мнимой диэлектрической проницаемости по формуле $\sigma_{\rm ac}(\omega, T) = \omega \varepsilon_0 \varepsilon''(\omega, T)$. Тогда общая



Рис. 3. Температурные зависимости AC и DC-проводимости в кристалле NBMN: a) — в полулогарифмическом масштабе и b) — в осях, соответствующих закону Аррениуса. Пунктирными линиями показано соответствие термоактивационному закону, стрелками положение частотно-зависимых максимумов AC-проводимости.

проводимость $\sigma(\omega, T)$ складывается из двух величин:

$$\sigma(\omega, T) = \sigma_{dc}(T) + \sigma_{ac}(\omega, T),$$

где σ_{dc} — сквозная проводимость на частоте $\omega = 0$, определяемая дрейфом свободных зарядов в постоянном поле (активная проводимость) и σ_{ac} — проводимость, связанная с диэлектрическими потерями (реактивная проводимость) [26].

На рис. 3, *а* показаны температурные зависимости для DC-проводимости и AC-проводимости монокристалла NBMN на разных частотах. Из рисунка видна дисперсия проводимости, величина которой увеличивается при увеличении частоты. В области температур выше 590 К наблюдается уменьшение дисперсии AC-проводимости. При T > 650 К поведение $\sigma_{ac}(\omega, T)$ подобно температурной зависимости $\sigma_{dc}(T)$. Такое же поведение AC-проводимости наблюдается в монокристаллах NBT в

той области температур (выше 620 К), где вклад в диэлектрический отклик релаксации Максвелла-Вагнера становится значительным [17]. На рис. 3, в высокотемпературном поведении $\sigma_{ac}(\omega, T)$ хорошо видны два линейных участка. Наибольший интерес вызывает область температур при T > 650 К, углы наклона зависимостей $\sigma_{ac}(\omega, T)$ и $\sigma_{dc}(T)$ практически одинаковы и хорошо описываются термоактивационным законом $\sigma_{dc}(T) = \sigma_0 \exp{-E_a/kT}$, где: σ_0 — постоянная, E_a энергия активации носителей заряда, k — постоянная Больцмана. Для кристаллов NBMN получены следующие параметры: $\sigma_0 = 5 \cdot 10^{-4} \,\Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$ и $E_a = 0.66 \,\mathrm{eV}$. Для сравнения, в кристаллах NBT в результате проведенного анализа проводимости энергия активации оценивается величиной 0.7-0.9 eV [17]. Более сложная ситуация с поведением проводимости в интервале температур от 430 до 650 К. На рис. 3, b хорошо видна аномалия в DC-проводимости в виде минимума в окрестности 530 К, при которой величина проводимости уменьшается практически на порядок, до значений $\sigma_{dc} = 10^{-10} \, \Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$. Эта аномалия не наблюдается в температурных зависимостях $\sigma_{ac}(\omega, T)$. Вместо нее, в обсуждаемом диапазоне температур мы видим практически линейную зависимость $\sigma_{ac}(\omega, T)$ (рис. 3, *b*). Причина такого аномального поведения проводимости требует дополнительных исследований.

На рис. З в низкотемпературной области видны две аномалии в зависимости $\sigma_{ac}(\omega, T)$: максимум в окрестности $T_2 \approx 300$ К и широкий, частотно-зависимый максимум в окрестности $T_m \approx 110$ К. Максимум АСпроводимости при T_2 отчетливо виден на низких частотах, маскируясь на высокочастотных температурных зависимостях увеличением значений проводимости и смещением в высокотемпературную область широкого частотно-зависимого максимума при T_m .

Еще одной особенностью DC-проводимости в NBMN является ее сравнительно высокая для диэлектриков со структурой перовскита величина проводимости на постоянном токе $\sigma_{dc} = 1 \cdot 10^{-9} \,\Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$ (при $T = 300 \,\mathrm{K}$, $U = 10 \,\mathrm{V}$), а также накопление объемного заряда, которое вызывает обратимый пробой. При температуре 77 K образцы толщиной 1 mm выдерживали поле 20 kV/cm в течение 1 min, при температуре выше 400 K пробой начинался в поле 10 kV/cm, а при температуре 700 K пробивное поле уменьшалось до 90 V/cm.

3.4. Измерение петель гистерезиса

Измерение петель сегнетоэлектрического гистерезиса проводилось при температуре 77 К с использованием метода PUND (Positive Up, Negative Down) [27]. В отличие от традиционного метода измерения петель, в этом методе поляризация диэлектрика осуществляется серией импульсов внешнего поля, состоящей из двух последовательных импульсов одинаковой полярности (импульсы 1-2 на рис. 4), затем двух одинаковых импульсов другой полярности (импульсы 3-4).



Рис. 4. Измерение поляризации образца NBMN PUND методом. Показаны импульсы тока, как отклик на серию импульсов высокого напряжения треугольной формы (показаны штриховой линией).

Применение этого метода позволяет выделить ток, связанный с переключением поляризации из общего тока, который складывается из тока проводимости J_b и тока смещения J_s. В свою очередь, ток смещения складывается из тока обратимой поляризации диэлектрика и тока переключения спонтанной поляризации. Все перечисленные составляющие тока, в том числе вклады, связанные с переключением поляризации, содержатся в первом положительном и первом отрицательном импульсах плотности тока J_1 и J_3 , после интегрирования которых могут быть получены Р-Е петли гистерезиса. Форма петли гистерезиса в кристалле NBMN, представленная на рис. 5, а, характерна для диэлектрика со значительным вкладом проводимости. Вклад тока проводимости также входит во второй положительный и второй отрицательный импульсы плотности тока (J₂ и J₄), но ток переключения поляризации в этих импульсах отсутствует. Поэтому, чтобы получить петли, содержащие данные о переключаемой поляризации, достаточно использовать разности величин импульсов токов $J_1 - J_3$ и $J_2 - J_4$.

На рис. 5, *b* показаны петли гистерезиса переключаемой поляризации в ВМNМ при температуре 77 К, которые получены как разность величин поляризаций P_1-P_3 и P_2-P_4 . Из рисунка можно видеть, что эти петли свидетельствуют о существовании переключаемой поляризации и демонстрируют характерную для сегнетоэлектрических гистерезисов кривую зависимости максимальной поляризации от поля (на рис. 5, *b* показано штриховой линией). Однако, судя по тому, что величина остаточной поляризации и коэрцитивное поле все время возрастают при увеличении амплитуды поля вплоть до пробивных значений ~ 20 kV/ст, можно считать, что P-E петли являются ненасыщенными (рис. 5, *b* и рис. 6).

Ненасыщенные петли гистерезиса также наблюдаются в большинстве сегнетоэлектриков-релаксоров [1–3]. В предпробойном внешнем поле 18 kV/ст остаточная



Рис. 5. Р–Е петли гистерезиса в кристалле NBMN: *a*) общий полярный отклик, включающий все вклады от поляризации и проводимости, *b*) полярный отклик, связанный только с переключением поляризации. Пунктиром показана зависимость максимальной поляризации от поля.



Рис. 6. Зависимости остаточной поляризации (*a*) и коэрцитивного поля (*b*) в кристалле NBMN от внешнего поля от внешнего поля.

поляризация достигает величины 2μ C/cm², а коэрцитивное поле — 14 kV/cm (рис. 6). При температуре выше 77 K наблюдается обратимый пробой кристалла вследствие активного накопления объемного заряда. Повидимому, влияние объемного заряда также сказывается на асимметрии петель в поле амплитудой меньше 18 kV/cm. Согласно [28] такого рода асимметрия петель гистерезиса часто обусловлена тем, что перед переключением поляризации связанный заряд в кристалле частично скомпенсирован объемным зарядом. Несимметричное пространственное распределение объемного заряда создает внутреннее поле, которое влияет на величину порогового поля в процессе переключения поляризации.

4. Заключение

В настоящей работе представлены результаты по синтезу и исследованию нового соединения — монокристалла сложного перовскита (Na_{1/2}Bi_{1/2})(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃. Проведенный рентгенофлуоресцентный анализ подтвердил его состав, а рентгеноструктурные исследования определили структуру кристалла NBMN при комнатной температуре как кубическую, пр. гр. *Рт*3m, $a = 3.954 \pm 0.001$ Å. Таким образом, в ходе работ по синтезу новых соединений удалось впервые вырастить монокристалл перовскита с разупорядочением как в А-, так и в В-подрешетке. Определен показатель преломления кристалла $n = 2.31 \pm 0.02$ на длине волны $\lambda = 0.633 \,\mu$ m. Показано, что в температурной зависимости диэлектрического отклика NBMN наблюдается две аномалии с температурой $T_2 \approx 300 \,\mathrm{K}$ и $T_m \approx 110 \,\mathrm{K}$. Максимум в окрестности Т2 частотно независим и может быть связан со структурным фазовым переходом. Широкий частотно-зависимый максимум в окрестности 110 К характерен для возникновения в кристалле релаксорного сегнетоэлектрического состояния при T < T_m. При 77 К в кристалле NBMN методом PUND обнаружено переключение поляризации с остаточной поляризацией $P_r = 2 \mu \text{C/cm}^2$ в поле 18 kV/cm и величиной коэрцитивного поля $E_c = 14 \, \text{kV/cm}$, что свидетельствует о существовании сегнетоэлектрического состояния. Таким образом, кристалл NBMN при T_m действительно переходит в релаксорное сегнетоэлектрическое состояние.

В интервале температур 290–350 К происходит изменение знака дисперсии мнимой диэлектрической восприимчивости, $d\varepsilon''/d\omega$, свидетельствующее об изменении механизма диэлектрических потерь, возможно, связанное с изменением характера проводимости кристалла от локальной к объемной. Это находит подтверждение и при анализе температурных и частотных зависимостей проводимости. Требует дополнительных исследований аномалия в проводимости в окрестности 530 К, которой отвечает аномальное поведение диэлектрического отклика.

Полученные результаты позволяют отнести NBMN к семейству релаксорных сегнетоэлектриков и представляют интерес для дальнейшего понимания механизмов фазовых переходов и превращений в частично разупорядоченных диэлектрических кристаллах. В прикладном аспекте монокристаллы NBMN могут рассматриваться как перспективный мультифункциональный материал для интегральной электроники.

Финансирование работы

Настоящая работа финансировалась за счет средств госзадания Минобрнауки РФ (тема FFUG-2024-0042).

Конфликт интересов

Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, М.С. Шур. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Наука, Л. (1971). 476 с.
- [2] L.E. Cross, Ferroelectrics 151, 305 (1994).
- [3] Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская, Н.Н. Крайник. ФТТ 2, 2982 (1960).
- [4] A.A. Bokov, Z.G. Ye. J. Mater. Sci. 41, 31 (2006).
- [5] R.A. Cowley, S. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, B. Roessli, G.M. Rotaru. Adv. Phys. 60, 229 (2011).
- [6] J.F. Scott. Annu. Rev. Mater. Res. 41, 229 (2011).
- [7] H. Palneedi, M. Peddigari, G.-T. Hwang, D.-Y. Jeong, J. Ryu. Adv. Funct. Mater. 28, 1803665 (2018).
- [8] X. Gao, J. Yang, J. Wu, X. Xin, Z. Li, X. Yuan, X. Shen, S. Dong. Adv. Matter. Technol. 5, 1900716 (2019).
- [9] S. Nomura, K. Uchino, R.E. Newnham. 23, 187 (1980).
- [10] T. Takenaka, K. Maruyama, K. Sakata. Jpn. J. Appl. Phys. 30, 2236 (1991).
- [11] S.B. Vakhrushev, V.A. Isupov, O.E. Kvyatkovsky, N.M. Okuneva, I.P. Pronin, G.A. Smolensky, P.P. Syrnikov. Ferroelectrics 63, 153 (1985).
- [12] G.O. Jones, P.A. Thomas. Acta Cryst. B 58, 168 (2002).
- [13] J. Petzelt, S. Kamba, J. Fabry, D. Noujni, V. Porokhonskyy, A. Pashkin, I. Franke, K. Roleder, J. Suchanicz, R. Klein, G.E. Kugel. J. Phys.: Cond. Matter 16, 2719 (2004).
- [14] V. Dorcet, G. Trolliard, P. Boullay. Chem. Mater. 20, 5061 (2008).
- [15] C.-S. Tu, I.G. Siny, V.H. Schmidt. Phys. Rev. 49, 11550 (1994).
- [16] S. Gorfman, P.A. Thomas. J. Appl. Cryst. 43, 1409 (2010).
- [17] В.Г. Залесский, А.Д. Полушина, Е.Д. Обозова, А.В. Дмитриев, П.П. Сырников, С.Г. Лушников. Письма ЖЭТФ 105, 175 (2017).
- [18] X. Wang, H.L.W. Chan, C.L. Choy. J. Am. Ceram. Soc. 86, 1809 (2003).
- [19] H. Nagata, N. Koizumi, T. Takenaka. Key Eng. Mater. 169– 170, 37 (1999).
- [20] D. Lin, D. Xizo, J. Zhu, P. Yu, H. Yan, L. Li, W. Zhang. Cryst. Res. Technol. **39**, 30 (2004).
- [21] S.E. Park, S.J. Chung, I.T. Kim, K.S. Hong. J. Am. Ceram. Soc. 77, 2641 (1994).
- [22] X. Wang, S. Or, X. Tang, H. Chan, P. Choy, P. Liu. Solid State Commun. 134, 659 (2005).
- [23] H. Yan, D. Xiao, P. Yu, J. Zhu, D. Lin, G. Li. Mater. Des. 26, 474 (2005).

- [24] Y. Yamada, T. Akutsu, H. Asada, K. Nozawa, S. Hachiga, T. Kurosaki, O. Ikagawa, H. Fujiki, K. Hozumi, T. Kawamura, T. Amakawa, K. Hirota, T. Ikeda. Jpn. J. Appl. Phys. 34, 5462 (1995).
- [25] S.R. McLaughlin. PhD thesis. Queen's University Kingston, Ontario, Canada (2008). 139 p.
- [26] D. O'Neill, R.M. Bowman, J.M. Gregg. Appl. Phys. Lett. 77, 1520 (2000).
- [27] K.M. Rabe, C.H. Ahn, J.-M. Triscone. Physics of Ferroelectrics. A Modern Perspective. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2007). 388 p.
- [28] K. Okazaki. Ceramic Engineering for Dielectric. Gakkensha, Tokyo (1969). 532 p.
- Редактор Ю.Э. Китаев